BONDING THE STARS







BAMFIT Bonder / Tester 5600

Test System

Testkopf Das speziell entwickelte Klemmwerkzeug

greift den Bondfuß seitlich bei definierter

Höhe; ein Touchdown-System gleicht variierende

Substrathöhen automatisch aus.

Testwerkzeug für Al-Dickdrähte von 125 bis 400 μm;

durch den Bediener in Minuten austauschbar

Testzeit 1 Test < 1 Minute

Testkraft Zugkraft in Z-Richtung, typ. 20 bis 50 cN

Testfrequenz 60 und 80 kHz, programmierbarer

Ultraschall-Generator

Testamplitude entspricht dem Temperaturhub beim PC Test;

programmierbar von 0 bis 1 µm

Testdaten Toolposition, Ultraschalldaten,... werden lauf-

end registriert und zur späteren Auswertung in einer Datenbank gespeichert. Die statistische Auswertung und Analyse kann dann mit der CSR (Corporate Standard Report) Software durchgeführt

werden.

BAMFIT-Tester

Das revolutionäre **BAMFIT- Testverfahren** ist durch einen speziellen Testkopf sehr einfach an jedem Basisgerät der Serie 56XX installierbar.

Die Software ist der Standard-Version für Bonder und Tester sehr ähnlich und erlaubt vollautomatisches Testen von beliebig vielen Bonds mit automatischer Feinjustierung der Testposition durch Bilderkennung.

Die Testresultate werden in einer Datenbank gespeichert und können jederzeit mit der CSR (Corporate Standard Report) Software analysiert und ausgewertet werden.

BONDING THE STARS



BAMFIT Zuverlässigkeits-Test

BAMFIT (Bond Accelerated Mechanical Fatigue Interconnection Test) ist ein völlig neuartiges Testverfahren, um Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Dickdraht-Wedgebonds abzuschätzen. Es ist die perfekte Erweiterung des klassischen Power-Cycling-Tests (PC): die zyklische Stressbelastung des Drahtbonds durch Temperaturwechsel wird durch mechanischen Stress nachgebildet, aber mit bedeutend höherer Zyklusgeschwindigkeit. Dadurch können PC-Tests, die häufig Wochen oder Monate dauern, innerhalb von Minuten simuliert werden.

Maschinenbasis

Arbeitsbereich X/Y-Achse 100x100 mm / Z-Achse 60 mm

Achsen Schrittauflösung 0,25 μm; Wiederholgenauigkeit <2 μm

Testkopf Austauschbare Bond- und Testköpfe mit automatischer Erkennung

Hardware Dual-Core PC mit Windows OS Ethernet,

USB 2.0/3.0, LCD Farbdisplay 22"

GigE-CMOS-Farbkamera

Netzwerkfähig mit Programm-Archivierung

Software Manuelle oder automatische Messungen an beliebig vielen Bonds

Abmessung B x T x H - 70 x 65 x 70 cm, Gewicht ca. 80 kg

Anschlüsse 100-240 VAC, 1 Phase, 50/60 Hz, max. 500 VA

Standard-Vakuumschlauch Ø 6 mm

F&S Bondtec Semiconductor GmbH

Industriezeile 49a

A-5280 Braunau am Inn

Tel.: +43-7722-67052-8270
Fax: +43-7722-67052-8272
Mail: info@fsbondtec.at
Web: www.fsbondtec.at

